

セキュアマテリアル・デバイス国際ワークショップ(IWMD-SS 2009) ～材料すり合せの過程で安全安心はどのように議論され組み込まれるか?～



日 時：平成 21 年 2 月 20 日（金）9：30～17：20

場 所：東京工業大学 大岡山キャンパス デジタル多目的ホール（西 9 号館 2 階）
東京都目黒区大岡山 2-12-1 （東急目黒線・大井町線 大岡山駅）

マップ <http://www.titech.ac.jp/access-and-campusmap/e/o-okayama-campus.html>

主 催：東京工業大学 統合研究院 URL: <http://www.iri.titech.ac.jp/>

共 催：東京工業大学応用セラミックス研究所
東京工業大学グローバル COE プログラム フォトニクス集積コアエレクトロニクス
東京工業大学フロンティア研究センター
東京工業大学大学院総合理工学研究科
IEEE EDS Japan Chapter

技術共催：IEEE Electron Devices Society
応用物理学会シリコンテクノロジー分科会

協 賛：日本電気化学会

備 考：参加無料

<趣 旨>

素材開発は絶えず日本経済を牽引する役割を担ってきた。統合研究院では、今後の我が国産業の持続的発展に向けて、社会及び個人の安全安心を確保するという価値観の高まりを無視することはできず、そのために材料が担うべき役割は大きいとの認識のもとに“セキュアマテリアル”というコンセプトを提唱している。本国際ワークショップでは、産業競争力は技術あるいはコストのみでは定まらないという時代認識のもとに、セキュアマテリアルの観点から技術統合マネジメントのあり方を明らかにする。第 3 回目となる今回は、半導体産業及び電池産業において材料が重要な役割を果たす製品開発を事例として、技術と社会要請とのすり合せによる安全安心な製品開発とはどのようにあるべきか、その課題と技術マネジメント戦略を問い直す。

<プログラム>

開会の挨拶 (9:30-10:00)

東京工業大学統合研究院ソリューション研究機構 機構長 上羽 貞行
東京工業大学応用セラミックス研究所 所長 近藤 建一
東京工業大学統合研究院イノベーションシステム研究センター 教授 石川 正道

講演会 (招待講演)

I. 電池開発における安全性のデザイン (10:00-11:50)

「安心安全な燃料電池を実用化するための技術的戦略」

燃料電池開発情報センター 顧問 本間 琢也

「材料科学から見たリチウム電池：安全性と信頼性を求めて未来の電池系へ」

東京工業大学大学院総合理工学研究科 教授 菅野 了次

「次世代高性能二次電池における安全性確保のための材料開発」

(独) 産業技術総合研究所電池システム研究グループ グループ長 境 哲男

昼食 (11:50-13:30)

II. 半導体開発における信頼性マネジメント (13:30-15:15)

「新規な応用に向けた CMOS 技術プラットフォームへの革新的材料の統合：

好機と安心安全への挑戦」

IME シンガポール 所長 Dr. Dim-Lee Kwong

「300mm シリコン R&D プロセスラインにおける新材料の導入に係る安全性及び信頼性の課題」

IMEC ベルギー 副所長 Prof. Cor Claeys

「ロジック及びメモリチップの信頼性要求とコンピュータシステムとの接点について」

IBM トマス・ワトソン研究所 IBM フェロー Dr. Tak Ning

休憩 (15:15-15:30)

ショートトーク (15:30-15:45)

「MPU 及びシステムの設計戦略から見た安全性及び信頼性」

東芝セミコンダクター(株) 首席技監 斎藤 光男

III. パネルディスカッション (15:45-17:15)

「材料・デバイス・システムの“すり合せ”による信頼性及び安全性の技術開発マネジメント」

本間 琢也、境 哲男、Dim-Lee Kwong、Cor Claeys、Tak Ning、斎藤 光男

司会進行 石川 正道

(敬称略、順不同)

閉 会 (17:20)

懇親会 (有料) 17:30～

会場：東京工業大学百年記念館 レストラン角笛 会費 3000 円

○お問合せ先：securematerial@iri.titech.ac.jp

○ご参加のお申込みは、次のURLから、必要事項をご記入の上ご送信ください。

また、懇親会 (有料) への参加を希望される方は、「備考」欄へその旨ご記入下さい。

<http://www.iri.titech.ac.jp/securematerial/form.html>



振興調整費